

GIS-E1020 From Measurements to Maps

Examination/Luentokuulustelu 17.02.2017

1. Tell about the accuracy of photogrammetric measurements, and what factors have influence on them.
/ Kerro fotogrammetristen mittausten tarkkuuksista ja mitkä asiat vaikuttavat niihin. (6 p)
2.
 - a. What are the types of maps that topographic surveying produces the raw data for? / Minkä tyyppisiin karttoihin topografiset mittaukset tuottavat raaka-aineistoa? (3 p)
Kuvaa rakennuksen paalutusmittaus. Kuka niitä tilaa, ketkä niitä tekevät ja miten ne tehdään? (3 p)
 - b. What is the basic assumption behind optical remote sensing? What does the spectral response of a target (e.g. an urban park) depend on? / Mihin perusoletukseen optinen kaukokartoitus perustuu? Mistä kohteen (esim. kaupunkipuisto) spektraali vaste on riippuvainen? (6 p)
3. What do interface standards WMS and WFS mean? What are the main differences between them? / Mitä rajapintastandardit WMS ja WFS tarkoittavat? Mitkä ovat niiden suurimmat eroavaisuudet? (6 p)
4.
 - a. Describe the principle and components of an airborne laser scanner. / Kuvaa ilmalaserkeilaimen toimintaperiaate ja osat. (4 p)
 - b. Tell about the speckle effect. / Kerro "speckle"-ilmiöstä. (2 p)